

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Juli 2005 (14.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/063407 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B05C 5/02

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/014697

(22) Internationales Anmeldedatum:  
23. Dezember 2004 (23.12.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 61 018.9 23. Dezember 2003 (23.12.2003) DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): QIIS GMBH [DE/DE]; Lilienthalstrasse 5, 82178 Puchheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): TOMTSCHKO, Andreas [DE/DE]; Rodelbahnstr. 15, 82223 Eichenau (DE). BERGER, Mirko [DE/DE]; Anglerstr. 11, 80339 München (DE). LINNENKOHL, Jan [DE/DE]; Oswald-Bieber-Weg 6, 81241 München (DE). RAAB, Roman [DE/DE]; Friedenspromenade 117, 81827 München (DE).

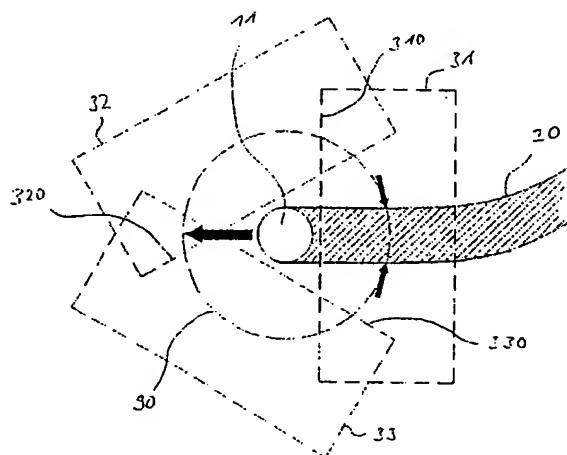
(74) Anwalt: KUNZ, Herbert; Hammonds Rechtsanwälte Patentanwälte, Karl-Scharnagl-Ring 7, 80539 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TI, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*

(54) Title: METHOD FOR THE RECOGNITION OF A STRUCTURE WHICH IS TO BE APPLIED TO A SUBSTRATE, USING SEVERAL CAMERAS AND DEVICE THEREFOR

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERKENNEN EINER AUF EINEM SUBSTRAT AUFZUBRINGENDEN STRUKTUR MIT MEHREREN KAMERAS SOWIE EINE VORRICHTUNG HIERFÜR



(57) Abstract: Disclosed is a method or device for recognizing a structure, preferably a bead or trace of adhesive material (20), which is to be applied to a substrate (30), with the aid of at least two cameras, more particularly three or more cameras (12, 13, 14). The structure, which is to be applied, is applied to the substrate using an applicator device (11), whereupon the structure, which is applied to the substrate by means of the applicator device, is monitored by the cameras in such a way that the cameras are oriented towards the applied structure with at least one overlapping area, wherein the applied structure, particularly the edges of the trace of adhesive, is determined on a revolving orbit around the applicator device and the revolving orbit is pre-defined in such a way that the applied structure intersects the revolving orbit after it has been applied to the substrate.

**WO 2005/063407 A1**

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Rechenschaftsbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

---

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum Erkennen einer auf einem Substrat (30) aufzubringenden Struktur, vorzugsweise eine Kleberraupe oder Kleberspur (20), mit mindestens zwei Kameras, insbesondere drei oder mehreren Kameras (12, 13, 14) beschrieben. Dabei wird die aufzubringende Struktur von einer Auftragseinrichtung (11) auf das Substrat aufgebracht und daraufhin wird die durch die Auftragseinrichtung auf dem Substrat aufgebrachte Struktur von den Kameras derart überwacht, dass die Kameras mit zumindest einem Überlappungsbereich auf die aufgebrachte Struktur ausgerichtet sind, wobei die aufgebrachte Struktur, insbesondere die Kanten der Klebstoffspur, auf einer umlaufenden Bahn um die Auftragseinrichtung ermittelt wird, und wobei die umlaufende Bahn derart vordefiniert ist, dass die aufgebrachte Struktur nach dem Aufbringen auf dem Substrat die umlaufende Bahn schneidet.